
**Céramiques techniques — Méthode
d'essai pour les défauts de surface des
cristaux de GaN —**

**Partie 1:
Classification des défauts**

*Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) —
Test method for GaN crystal surface defects —
Part 1: Classification of defects*

(<https://standards.itch.ai>)

Document Preview

ISO 5618-1:2023

<https://standards.itch.ai/catalog/standards/iso/7f5a03fc-5b75-4aad-82c6-844652c143d9/iso-5618-1-2023>



iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 5618-1:2023

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/7f5a03fc-5b75-4aad-82c6-844652c143d9/iso-5618-1-2023>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2023

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Classification des défauts	3
4.1 Généralités	3
4.2 Description des classes de défauts	3
4.2.1 Dislocation	3
4.2.2 Défauts induits par le process	6
Bibliographie	8

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 5618-1:2023

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/7f5a03fc-5b75-4aad-82c6-844652c143d9/iso-5618-1-2023>